X線位相イメージング法による漆器中の繊維状物質の検出

岡本 博之, 内藤 愛莉奈¹⁾, 水野 薫²⁾

KEY WORDS

Phase contrast imaging, Scatter image, lacquerware, X-ray DEI method, anisotropy

はじめに

日本国では古代から漆器が使用され、伝統的産業も 発展している¹⁾。しかし近年,廉価品の普及により, 伝統的漆器を使用する機会は減少している。一方で, その美術的価値から、重要な行事や宗教施設では、現 在でも使用される機会が多く,技術の伝承が重視され ている。そのため, 廉価品との差別化が必要となるが, 塗りが施された後での判別は困難である。そこで我々 は、X線位相イメージング法により輪島塗特有の構造 が検出できることを確認し報告した^{2,3)}。その際に使 用した手法では,等方的な微細構造を仮定し位相像を 得る。そのため、繊維質のような異方的物性を持つ物 質については, 方位について平均化された情報が得ら れ、繊維質を含む部位であるかどうかを、物理量の違 いとして確認出来ない。一方で、例えば漆器の原型と なる木材部は繊維質である。また、輪島塗の代表的技 法である布着せ部分にも, 異方的な布繊維が存在する。 そのため先の研究では、漆器特有の特徴を持つ幾つか の部位について、その存在を物理量の違いとして示す ことは出来なかった。そこで本研究では、異方的物質 からの散乱が評価できるように改良した拡張型 DEI 法 (Multiple-Image Radiography)を使用し, 輪島塗中に 存在する繊維状物質の検出,同定を試みた⁴⁾。

位相イメージング法には複数の手法が存在し,それ ぞれの特徴を生かし,産業や医療分野への応用が検討 されている⁴⁻¹²⁾。今回使用した拡張型 DEI 法は,シン クロトロン光源を使用して高感度に位相情報を検出可 能であり,漆器のような減弱が小さい物体の観察に向 いている⁴⁾。

方法

散乱の異方性評価には, タルボ干渉計を利用した方 法が多く使用される¹³⁾。しかしながら、本研究ではこ れまでの成果と比較するため,拡張型 DEI 法を使用し た^{3,4)}。実験は高エネルギー加速器研究機構放射光科 学研究施設(KEK-PF)のBL-14Bで行った。鉛直上方 から観察した実験装置の配置を図1に示す。DEI法は Si 単結晶による回折現象を利用するため、単色 X 線が 必要である。そこで、シンクロトロンから放射される 白色 X 線を,モノクロメータにより 20.7 keV に単色化 した。BL-14B では、このエネルギー領域でビーム強 度と安定性が良い。次に、回折面を (220) とする Si 製 コリメータによる非対称回折で指向性を高めつつビー ムの幅を広げ、回転ステージに設置された試料に照射 した。その後, 試料と相互作用をしたX線をSi(220) のアナライザーで回折させ、CCD カメラで検出した。 CCD カメラの画素サイズは $6.4 \times 6.4 \ \mu m^2$ である。ア ナライザー角度は 0.49 µrad ずつ変化させ、計 200 枚



金沢大学医薬保健研究域保健学系

¹⁾ 金沢大学大学院医薬保健学総合研究科

²⁾ 島根大学教育学部

の撮影を行い, 散乱像を得た。露出時間は 2.0 sec/ 枚 とした。

以下に,拡張型 DEI 法により像を得る原理を示す。 まず,図1の試料が無い状態でアナライザー設置角度 θ を変化させると,ブラッグの条件を満たす角度で回 折 X線の強度が最大となり,外れると小さくなる¹⁴⁾。 このとき CCD カメラの各画素では,図 2(d) ~ (f) に 実線で示す,ロッキングカーブと呼ばれる回折 X線の 強度曲線が得られる。次に試料を置くと,試料と相互 作用をした X線がアナライザーに入射する。このとき 図 2(a)のような減弱が生じると,図 2(d)破線のよう に積分強度が減少する。外形変化により図 2(b)のよ うな屈折が生じると,図 2(e)破線のように中心(期待 値)が移動する。微細構造により図 2(c)のような散乱 が生じると,図 2(f) 破線のように広がり(標準偏差)



図 2. 試料と X 線の相互作用でロッキングカーブに生じる変化 (a) は減弱,(b) は外形変化による屈折,(c) は微細構造による 散乱を示す。(d) ~(f) の横軸はアナライザー角度,縦軸は回折 X 線強度である。横軸の中心をブラッグ条件としている。実線は 試料がない時,破線は試料により(d)減弱,(e) 屈折,(f) 散乱が 生じた際のカーブである。



図3. 回転ステージに設置した試料と座標軸の定義 試料回転ステージと座標軸の定義の関係を示す。図のx, y, z 軸は、図1の中に示した座標軸と対応している。回転ステージ の回転軸は y 軸と平行である。x 軸を方位角 φ =0°の基準とし, y 軸の上流側に向かって時計回りに回転した。試料の撮影したい 領域を回転ステージの中央に設置した。 が変化する。そこで、各画素で観測されたロッキング カーブについて統計処理を行い、各像を作成する³⁾。 本研究では、試料の有無による標準偏差の変化、すな わち図 2(f) に示した実線と破線の標準偏差の差を散乱 角とし、これを画素値として散乱像を作成した。なお、 本装置のアナライザー回転軸は鉛直であるため、水平 (x 軸)方向の散乱のみ検出可能である。仮に、繊維状 の物質が存在すると、繊維に平行方向の散乱は小さく、 垂直方向では大きくなる。つまり、散乱の異方性を評 価することにより、繊維状物質を検出可能である。そ こで、図 3 に示すような回転ステージに試料を設置し、 方位角 ϕ を10°ごとに変化させながら 360°の範囲で撮 影を行い、計 36 枚の散乱像を得て変化を観察した。な お、図 3 のx, y, z 軸は、図 1 中の座標軸と対応して いる。また、方位角 ϕ で得られた散乱角を S_{ϕ} とする。

試料は,先の研究でも使用した1990年製造の輪島 塗椀である³⁾。外形を図4(a)に示す。伝統的漆器は多 くの製造工程から成り,産地ごとに異なる^{15,16)}。一般 的な輪島塗は図5の工程で製造され,①と③では繊維 質の材料が使用される。試料の椀にも高台部に布着せ が施されている。そこで,図4(b)のように高台部を, 表面に対し垂直に1 mm厚に加工し観察した。



図 4. 実験に使用した輪島塗椀と試料 (a)は 1990 年製造の輪島塗椀である。(b) は椀の高台部分を 1 mm 厚に加工した試料である。



図 5. 一般的な輪島塗の製造工程

①~⑩の工程に沿って製作される。①と③の工程では繊維質の 材料が使用されている。 結果

方位角を $\phi = 0^\circ$, 30°, 60°, 90°とした散乱像を図 6(a) ~ (d) に示す。部位による違いを調べるため, 図 6(a) の①木地, ③布着せ, ⑤地付け, ⑦中塗り, に関 心領域をとり, 36 枚の散乱像から得た $\phi \ge S_{\phi}$ の関係 を図 7 に示す。繊維質である①, ③はひょうたん型を 示し, S_{ϕ} に異方性が存在した。一方, 鉱物粒子を含む ⑤, 水酸化鉄コロイドを含む⑦では円に近い型を示し 等方的であった。さらに, ①, ③に比べ⑤, ⑦では全 体的に S_{ϕ} が大きくなった。このような情報を画像化 するため, 次の方法を用いた。



図 6. 方位角を変化させたときの散乱像の変化 (a) 方位角 φ = 0°, (b)30°, (c)60°, (d)90°で得た散乱像。各 像とも散乱角の大きさ 5 μrad を黒, 15 μrad を白に割りあてて いる。



図7. 方位角と散乱角の関係

方位角 ϕ を変化させたときの,図 6(a) ①木地(青),③布着せ(緑),⑤地付け(赤),⑦中塗り(橙)に四角で示した関心領域における散乱角 S_{ϕ} の変化。



図 8. 繊維物質からの異方的散乱の模式図 繊維状の物体からは,青線のような異方的散乱が生じる。二点 鎖線は繊維の方向を示す。

図 7 から得られた異方的な S_{ϕ} を,模式的に図 8 に 青実線で示す。散乱が大きい程曲線は原点 O から離れ る。そこで、当該部分の平均的な散乱の大きさを表現 するため、式(1)に従って画素ごとに S_{ϕ} の平均値 S_{av} を求め画像を作成した。ここで、n=36である。

$$S_{\rm av} = \frac{1}{n} \sum_{\phi} S_{\phi} \quad \cdots \quad (1)$$

これは, 異方的な散乱を図8の半径*S*_{av}赤破線円の 仮想的等方散乱と考えた際の画像である。これを「方 位角散乱平均像」とする。

次に、散乱の異方性の大きさを、仮想的等方散乱からのずれと考え、図 8 の水色矢印で示す。その評価指標として、 S_{av} を中心とした標準偏差 S_{SD} を、式(2)に従って求めた。等方的散乱では $S_{SD}=0$ である。

$$S_{\rm SD} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{\phi} \left(S_{av} - S_{\phi} \right)^2} \quad \cdots \quad (2)$$

ただし、一般に標準偏差は平均値に連動して変化する¹⁷⁾。これは、例え異方性が同等でも、 S_{av} が増加すると連動して S_{SD} が増加することを意味する。そのため、 S_{SD} は異方性のみを評価する指標として適切でない。そこで、 S_{av} の影響を除き異方性のみの情報を表す指標として、式(3)に従い変動係数 S_{CV} を求めた。

$$S_{\rm CV} = \frac{S_{\rm SD}}{S_{\rm av}} \quad \cdots \quad (3)$$

S_{cv}を画素値とした画像を「方位角散乱変動係数像」とする。加えて,異方的散乱を生じる物質の繊維方向

は、 S_{ϕ} が最大値 $Max(S_{\phi})$ をとる方位角 ϕ_{Max} と垂直方 向である。そこで、その方向をカラー表示の画素値と した画像を「繊維方位像」とする。これらの原理に基 づいて作成した画像を図 9 に示す。図 9(a) 方位角散 乱平均像、(b) 方位角散乱変動係数像、(c) 繊維方位像 である。



図 9. 散乱に関して得られた像

(a) 方位角散乱平均像,(b) 方位角散乱変動係数像,(c) 繊維方 位像である。

考察

まず図 9(a) より、中塗り層についての S_{av} は約 12 μ rad と相対的に大きかった。中塗り層には、コロイド状の 水酸化鉄が存在する。鉄は X 線を屈折しやすいため、 微細構造により様々な方向への屈折が生じ、散乱が大 きくなったと考えられる。次に、地付け層についても 約 8 μ rad の散乱が生じている。この部分には珪藻土 粉末が含まれており、その主成分は二酸化ケイ素であ る。ケイ素も比較的 X 線を屈折しやすいため、散乱が 大きくなったと考えられる。一方でこれらの部分では、 図 9(b) から S_{cv} は 0.15 以下であり,異方性は小さい。 これらの部分に含まれる粒子は、3 次元的にランダム に含まれていることに対応していると考えられる。

木地や布着せでは、図 9(a) から S_{av} が 5 μ rad 以下 であり、中塗り層、地付け層に比べ小さかった。この 部分は、主に X 線を屈折しにくい有機物から構成され るためだと考えられる。一方で、図 9(b) から S_{CV} は約0.5 であり、大きな異方性を確認できる。つまり、繊維質 が含まれることが確認できた。また、図 9(c) から木地 について、繊維の方向は ϕ =90°、つまり画像の上下方 向であることが分かった。このことは、図 4(b) の光 学写真の観察結果、および、図 7 ①の結果と対応して いる。対して、布着せ層の繊維方向は図 9(c) から色々 な方向を向くことが分かる。布繊維は織られているた め、様々な方向を向くと考えられる。

以上より,得られた画像と輪島塗の構造を比較する ことで,矛盾のない画像が得られていることが分かっ た。すなわち,本手法により物体中に存在する微細構 造が繊維質であるかどうかを評価可能である。

謝辞

本研究のため貴重な輪島塗を提供してくださった輪 島塗作家の箱瀬淳一氏,実験に関し技術的支援を頂い た高エネルギー加速器研究機構の平野馨一氏に謹んで 感謝の意を表します。

本研究は、Photon Factory Program Advisory Committee の承認を得て実施しました(課題番号:2016G189, 2018G055)。また、本研究はJSPS 科研費 JP18K12027 の助成を受けたものです。

文献

- 1)四柳嘉章 (2009):漆の文化史, 2-8,岩波新書.
- 2) 岡本博之,水野薫 (2013): X 線屈折コントラスト法 による輪島塗の観察,金沢大学つるま保健学会誌, 37(2), 51-56.
- 岡本博之,内藤愛莉奈,水野薫(2019):X線位 相イメージング法による漆器の観察,Journal of Wellness and Health Care, 43(2), 85-88.
- 4) M. N. Wernick, O. Wirjadi, D. Chapman, et al. (2004): Multiple-image radiography, Phys. Med. Biol. 48, 3875-3895.
- 5) K. M. Podurets, V. A. Somenkov, and S. Sh. Shilstein (1989): Refraction-contrast radiography, Sov. Phys. Tech. Phys., 34, 654-657.
- 6) A. Momose, W. Yashiro, S. Harasse, et al. (2010): Four-dimensional x-ray phase tomography with Talbot interferometer and white synchrotron light. SPIE proceedings 7804, 780405.
- 7) A. Bravin, P. Coan and P. Suortti (2013): X-ray phase-contrast imaging: from pre-clinical applications towards clinics, Phys. Med. Biol. 58(1), R1-35.
- 8) F. A. Vittoria, Gibril K. N. Kallon, Dario Basta, et al. (2015): Beam tracking approach for single-shot retrieval of absorption, refraction, and dark-field signals with laboratory x-ray sources, Appl. Phys. Lett. 106, 224102-1-5.

- 9) 森浩一, 関根紀夫, 佐藤斉, 他 (2002): 放射光 X 線 を用いた屈折コントラストによる骨画像, 医学物 理, 22(1), 13-20.
- 10) K. Mizuno, A. Fujimori, H. Okamoto, et al. (2017): Determination of minimum detectable refraction angle in X-ray diffraction-enhanced imaging via standard test piece, Jpn. J. Appl. Phys. 56, 066601-1-4.
- 岡本 博之,藤森茜,水野薫,他 (2019): X 線位相イ メージング法により得られる散乱像の分解能評価, Journal of wellness and health care, 43(1), 101-104.
- 12) K. Mizuno, H. Okamoto, K. Kajiwara, et al. (2006): Visualization of Hydride in Titanium and Titanium-Aluminide by Refraction-Enhanced X-ray Imaging Technique, Materials transactions 47(5), 1299-1302.
- 13) V. Revol, B. Plank, C. Kottler1, et al. (2014): Laminate Fibre Structure Characterisation by Orientation-selective X-ray Grating Interferometry, 5th Conference on Industrial Computed Tomography (iCT2014), 25-28.
- 14) 菊田星志 (2011): X 線散乱と放射光科学 基礎編, 50-60, 東京大学出版会.
- 15) 松田権六 (2001): うるしの話, 179-217, 岩波文庫.
- 16) 中里寿克 (2000): 産地別 すぐわかる うるし塗りの 見わけ方, 10-21, 東京美術.
- 17) 井上克己,岡本博之,城戸照彦 (2008): 医療統計学の基礎, 15-17, 医学出版.